

# 31W 型 一米平面光栅摄谱仪



## 一. 用途:

本仪器利用平面反射式光栅分光研究物质的成份和含量，主要用于金属合金（包括矿物矿井石）的日常定性量分析，纯金属和材料的杂质鉴定，与各种附件配合，用作激光微区分析、记录闪光和弱光现象。

## 二. 仪器特点:

1. 光学系统采用艾伯特垂直对称形式装置，彗差及象散可矫正到理想程度，在较长谱面范围内谱线清晰，结构均匀，灵敏度高。
2. 仪器采用三透镜消色差照明方法，狭缝得到均匀照明，使同一条谱线黑度均匀。
3. 仪器缝前的哈特曼光栏及三阶，九价减光板。
4. 适用控制箱控制谱过程。
5. 仪器配备直流电弧，交流电弧光源，以适应不同分析任务的需要。
6. 仪器配置工作台，安装和操作方便。
7. 在预处理阶段的铁样品的标准波长处谱线清新。
8. 中心波长显示实现 UI 界面与人机互动。
9. 采用高精密度的丝杆和光栅调节中心波长。
10. 仪器采用全数字控制，可以实现相板移动自动化。
11. 仪器实现全数显化，可直接显示预燃、曝光、板移的时间和中心波长。

## 三. 规格:

工作波段：200nm~850nm

摄谱仪焦距：F=1050 mm

相对孔径：A=1: 22

狭缝主要技术指标：宽度范围 0.002~0.3mm 宽度分度值 0.001mm

有效高度 10mm 宽度再现性 0.001mm

波长显示：计数器(nm)

光栅：200条/mm光栅2块

外形尺寸：长×宽×高 1300×1500（包括导轨在内）×600 mm

重量：100kg

工作电源：380V 50Hz 20A 220V 50Hz 20A